

**Hierarchical approach to test generation for digital systems at system, circuit and defect levels**

**Ubar, Raimund-Johannes** 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 04.-06.10.2000 : Tagungsband 2000 / S. 711-716 : III

**Interactive teaching software "Introduction to digital test"**

**Ubar, Raimund-Johannes**; Wuttke, Heinz-Dietrich; **Orasson, Elmet** 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 04.-06.10.2000 : Tagungsband 2000 / S. 949-954

**Java-based system for finite state machine decomposition**

**Sudnitsõn, Aleksander**; Levenko, Aleksei; Andreev, Dmitri 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 04.-06.10.2000 : Tagungsband 2000 / S. 961-965 : III

**Partition search problem for finite state machine decomposition**

**Sudnitsõn, Aleksander** 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 04.-06.10.2000 : Tagungsband 2000 / S. 673-678 : III